

В диссертационный совет
ФТИ 34.01.02

ОТЗЫВ на автореферат диссертационной работы Нечаева Дмитрия Валерьевича
«Плазменно-активированная молекулярно-пучковая эпитаксия гетероструктур
(Al_xGa_{1-x})N/c-Al₂O₃ для оптоэлектронных приборов среднего ультрафиолетового диапазона
(λ<300 нм)», представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников.

Развитие полупроводниковой оптоэлектроники на основе соединений AlGaN во многом определяет дальнейший прогресс в применении ультрафиолетового излучения с рабочими длинами волн от 210 до 360 нм. Однако до сих пор все выпускаемые ультрафиолетовые светоизлучающие диоды характеризуются относительно невысокой квантовой эффективностью, которая значительно снижается с уменьшением длины волны λ<300 нм. Основные технологические проблемы в этой области связаны в первую очередь с формированием высокой плотности дефектов в AlGaN гетероструктурах при их росте на экономически доступных, решеточно рассогласованных подложках (c-Al₂O₃ или Si(111)), а также со снижением структурного качества гетероструктур AlGaN при увеличении содержания Al и, наконец, со сложностью их легирования примесью p-типа. Поэтому тема диссертационной работы Нечаева Д.В. является актуальной как с точки зрения фундаментальных исследований роста наногетероструктур AlGaN, так и с точки зрения их практического применения.

Диссертационная работа Нечаева Д.В. представляет собой законченное исследование особенностей синтеза соединений Al_xGa_{1-x}N (0<x<1) на решеточно рассогласованных подложках c-Al₂O₃ технологией плазменно-активированной молекулярно-пучковой эпитаксии (ПА МПЭ) для ультрафиолетовых (УФ) оптоэлектронных приборов.

Автореферат диссертационной работы Нечаева Д.В. всецело отражает основные научные достижения и результаты проделанной соискателем работы. Им были развиты алгоритмы обработки картин дифракции отраженных быстрых электронов для количественной оценки изменения *a*-постоянной решетки во время роста слоев III-N. Существенная работа была проделана Нечаевым Д.В. и в изучении кинетики роста тройных соединений (Al_xGa_{1-x})N. В частности, были экспериментально исследованы процессы адсорбции/десорбции атомов III-группы и теоретически установлены энергии активации для Ga и Al, а также выведены уравнения баланса ростовых потоков, на основе которых была развита методика температурно-модулированной эпитаксии тройных соединений, использование которой

позволило получить атомарно-гладкую морфологию поверхности ($\text{rms} \sim 0.4 \text{ нм}$ на $2 \times 2 \text{ мкм}^2$) без кластеров металла.

Не менее важны исследования соискателя, направленные на развитие методов снижения плотности прорастающих дислокаций в буферных слоях AlN, во время их роста на подложках c-Al₂O₃. Проведенные Нечаевым Д.В. исследования свидетельствуют, что на начальных стадиях ПА МПЭ зародышевых слоев AlN наиболее эффективным методом снижения плотности прорастающих дислокаций является эпитаксия с повышенной миграцией атомов, обеспечивающая формирование крупнозернистой морфологии поверхности. Для дальнейшего снижения плотностей прорастающих дислокаций в буферных слоях AlN соискателем был предложен и развит метод введения множественных вставок тонких слоев GaN, на которых прорастающие дислокации отклонялись от вертикального направления с последующим усилением их взаимодействия между собой. В результате плотности винтовых и краевых прорастающих дислокаций были снижены до $1.5 \cdot 10^8$ и $3 \cdot 10^9 \text{ см}^{-2}$ соответственно. На основе развитых в работе эпитаксиальных методов, а также теоретическому анализу и моделированию активных областей приборов были изготовлены и исследованы опытные образцы УФ фотоприёмных и светоизлучающих приборов. Разработка фотокатодов AlGaN:Mg с отрицательным электронным сродством позволила продемонстрировать фотокатод (на основе AlGaN) с рекордной максимальной чувствительностью 27mA/Bт на $\lambda=226 \text{ нм}$. В автореферате кроме фотоприёмных приборов также демонстрируются возможности технологии молекулярно-пучковой эпитаксии в создании различного типа УФ- светоизлучающих приборов: светодиода, гетероструктур с внешней электронной и оптической накачкой для спонтанного и стимулированного излучения соответственно.

Полученные результаты опубликованы в более чем 50 статьях в рецензируемых журналах, а также апробированы в ходе проведения многих российских и международных конференций по физике полупроводников и нитридной тематике в частности.

Считаю, что диссертационная работа Нечаева Д.В. «Плазменно-активированная молекулярно-пучковая эпитаксия гетероструктур (Al,Ga)N/c-Al₂O₃ для оптоэлектронных приборов среднего ультрафиолетового диапазона ($\lambda < 300 \text{ нм}$)» отвечает всем необходимым требованиям к кандидатским диссертациям, а ее автор, Нечаев Дмитрий Валерьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников.

Ведущий научный сотрудник лаборатории наноэлектроники
СПБАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова, канд. физ.-мат. наук

А. М. Мизеров

Почтовый адрес организации:

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук»

194021, Санкт-Петербург, улица Хлопина, дом 8, корпус 3, литер А

Телефон: +7 812 448-69-80

email: andreymizerov@rambler.ru